



► **EINLADUNG**

15. Technologie- und Expertenkongress

**28. März 2012**

**Studio 44 der Österreichischen  
Lotterien – Wien**

**Jetzt anmelden und  
Teilnahme sichern!**

Faxformular auf der Rückseite



Aktuelle Informationen zum Kongress finden Sie auch unter [ni.com/austria/nidays](http://ni.com/austria/nidays)

## Chancen erkennen – und konsequent nutzen



### Herzlich willkommen zu den 15. NIDays in Wien!

Wie soll man reagieren, wenn man von allen Seiten laufend mit dem Thema „Krise“ konfrontiert wird? Einstimmen in Wehklagen, Trübsal blasen, resignieren und sich mit dem Schicksal abfinden? Leider sehen wir diese Reaktionen nur allzu oft.

Sind wir uns doch mal ehrlich, gab es wirklich einmal eine einfache Zeit? Jede Epoche hatte ihre Herausforderungen, jedoch gab es immer auch Chancen. Für den Standort Österreich ist es entscheidend, die sich bietenden Chancen und die Stärke des Standortes konsequent zu nutzen. Das Erkennen von Chancen und neuen Innovationen geschieht jedoch selten im „stillen Kämmerlein“, sondern im Dialog mit Kollegen und Fachleuten, gerade auch aus anderen bzw. branchenfremden Bereichen. Genau an diesem Punkt setzt der NIDays-Kongress an.

Sie treffen dort auf innovative Ingenieure, Wissenschaftler und Forscher aus unterschiedlichsten Fachbereichen. Die NIDays sind die ideale Plattform, um Erfahrungen auszutauschen, Neues zu lernen und sich Inspirationen zu holen.

Der Wissensstandort Österreich braucht gerade diesen Dialog, um sich für die Zukunft zu rüsten. Es geht darum, nicht mehr, sondern effizienter und intelligenter zu arbeiten und sich auf zukunfts-trächtige Wachstumsbereiche auszurichten und dort mit Innovationen à la „Made in Austria“ aufzuwarten.

Dazu muss die Produktivität gesteigert und die Innovationszyklen verkürzt werden. Hierfür ist es wichtig, Forschungsergebnisse schneller am Markt umzusetzen. Wie das in der Praxis funktioniert erfahren Sie am besten durch unsere zahlreichen Anwendervorträge, die von der Grundlagenforschung, Energie-Effizienzsteigerung, Qualitätssicherung bis hin zur Steuerung industrieller Anlagen berichten.

Bei den NIDays erwarten Sie auch unsere Alliance Partner sowie Experten von National Instruments aus USA, Deutschland und das gesamte NI Austria Team.

Dies und viele neue Ideen und Technologien bieten Ihnen die NIDays.

Auf Ihr Kommen zu den NIDays freue ich mich.

Günther Stefan  
Branch Manager National Instruments Austria

## Keynotes: Einsichten, die unser Bild der Welt verändern

→ Von den jüngsten Entwicklungen in der Medizintechnik zu brandaktuellen Innovationen im Graphical System Design: Die Keynotes der NIDays 2012 richten den Fokus auf revolutionäre Fortschritte in Wissenschaft und Anwendung.

### 🕒 09:00-09:30 Graphical System Design - It Starts with Prototyping

**Greg Crouch,**  
**Director Medical/Life Science Segment,**  
**National Instruments Corp.**

Greg Crouch ist Life Science Business Development Director bei National Instruments. Zu seinem Aufgabenbereich zählen die Unternehmensstrategie und Partnerschaften im Geschäftsbereich der Biotechnologie. In kürzlich von ihm durchgeführten Projekten wurden u. a. Vorgaben zur Definition von LabVIEW for ARM Microcontrollers in Zusammenarbeit mit ARM Ltd. sowie zur Technologie von LabVIEW für Blackfin-Prozessoren von Analog Devices festgelegt. Beide NI-Technologien gehören zu dem auf Graphical System Design basierenden Pro-

duktangebot für den Bereich Biotechnologie. Außerdem engagiert sich Greg Crouch für das STEM-Programm (Science, Technology, Engineering and Math), um die Begeisterung für Technik bei jungen Leuten zu wecken, und führt gemeinsam mit globalen Technologieanbietern wie Xilinx, Freescale, Texas Instruments, Wind River und Analog Devices ein Programm durch, bei dem ein hochmoderner Robotik-Controller für die USFIRST.org entwickelt wird.

In dieser Keynote präsentiert Ihnen Greg Crouch, wie der erfolgreiche Einsatz von NI-Werkzeugen im Bereich Medizintechnik hilft, die Entwicklungszeit zu reduzieren und den Produkterfolg zu erhöhen.



Greg Crouch,  
Director Medical/Life Science Segment,  
National Instruments Corp.

### 🕒 09:30-10:30 New Product & Technology Introduction

In dieser Keynote öffnen wir den Vorhang zum R&D-Center. Wir präsentieren Ihnen mit zahlreichen Kollegen aus unterschiedlichen, weltweit verteilten R&D-Zentren von National Instruments neue Produkte

und Technologien sowie alles über das NI-Konzept des Graphical System Design. Entdecken Sie im Rahmen von Live-Demonstrationen die aktuellen Technologietrends und gewinnen Sie spannende

Einblicke in die Produktentwicklung von NI. Das Anwendungsspektrum umfasst die industrielle Mess- und Prüftechnik, automatisierte Tests, Steuer- und Regeltechnik sowie Embedded Control & Monitoring.

# Vortragsreihen: Gebündeltes Know-how aus erster Hand

→ Von Experten für Experten: Profitieren Sie vom umfassenden Know-how erfahrener Entwickler, Anwender und NI-Ingenieure.



## Datenerfassung und Signalkonditionierung/Industrielle Datenerfassung und Bildverarbeitung

Als Marktführer im Bereich softwarebasierte Messgeräte integriert National Instruments laufend neue Technologien und Trends in sein breites Produktspektrum. So sind wir in der Lage, Anwendern immer neue Einsatzgebiete und Lösungen zu eröffnen. In dieser Vortragsreihe demonstrieren Ihnen Anwender, wie sie sich das Engagement von NI für ihre individuellen Anforderungen erfolgreich zunutze machen. Anhand aktueller Produkte und daraus resultierenden Kundenlösungen erhalten Sie wertvolle Einblicke in die permanente Weiterentwicklung von der Messtechnik über die Signalkonditionierung bis hin zur Bildverarbeitung.

## Anwendungsentwicklung, Tipps & Tricks

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert revolutioniert NI LabVIEW die Mess- und Prüftechnik. Die kontinuierlichen Weiterentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte haben LabVIEW zu einer ausgereiften, vollwertigen Engineering-Plattform geformt. In dieser Vortragsreihe präsentieren Ihnen NI-Experten geballtes Wissen rund um das Thema Anwendungsentwicklung. Schwerpunkte sind u. a. die Leistungs- und Geschwindigkeitsoptimierung sowie die Netzwerkkommunikation und Tipps bei der Implementierung von Benutzeroberflächen.

## Versuchssteuerung und technisches Datenmanagement

Kürzere Produktzyklen, hoher Qualitätsanspruch und innovatives Design gehen während der Produktentwicklung Hand in Hand mit umfangreichen Tests auf Basis leistungsfähiger Hard- und Software. Die Auswertung der Messergebnisse muss damit Schritt halten können. Denn eine zeitnahe Bereitstellung kann schließlich nur durch entsprechende Werkzeuge erreicht werden. Diese Vortragsreihe stellt neue Möglichkeiten und Konzepte bei der Versuchssteuerung und im technischen Datenmanagement vor, um in den entscheidenden Bereichen wie Datenorganisation, Auswertung und Berichterstellung Schritt halten zu können.

## Industrial Measurement & Control

Kostenminimierung durch innovatives und effizientes Engineering: ein heiß diskutiertes Thema im gesamten Bereich der industriellen Mess-, Prüf- und Regelungstechnik. Dementsprechend haben sich auch die hier eingesetzten Systeme in den letzten Jahren stark gewandelt und müssen immer höheren Ansprüchen an Leistungsfähigkeit und Funktionsvielfalt genügen. In dieser Vortragsreihe zeigen wir Ihnen, wie Anwender diesen Herausforderungen begegnen, z. B. mit der FPGA-basierten Industrieplattform NI CompactRIO – und dabei immer wieder im Stande sind, die wachsenden Anforderungen zu erfüllen.

## Automatisierte Prüfsysteme

In den letzten Jahren haben zahlreiche neue Technologien den Bereich der automatisierten Prüfsysteme revolutioniert. Nun gilt es, diese in bestehende Prüfstandskonzepte zu integrieren und neue leistungsfähigere Standardsysteme zu realisieren. Erfahren Sie anhand anschaulicher Beispiele aus den unterschiedlichsten Industriebereichen, wie Sie modulare, softwaredefinierte Prüfsysteme mit höherem Durchsatz und verbesserter Flexibilität zu geringeren Gesamtkosten erstellen. Außerdem demonstrieren wir Ihnen die besten Verfahrensweisen für die Entwicklung effizienter Prüfmittel.

	⊙ Saal1	⊙ Großer Saal	⊙ Saal2
08:15-09:00	Registrierung/Besuch der Ausstellung		
09:00-09:30	Keynote: Graphical System Design - It Starts with Prototyping Greg Crouch, National Instruments Corp.		
09:30-10:30	New Product & Technology Introduction Günther Stefan, Daniel Riedelbauch, Christoph Landmann, National Instruments Austria/Germany		
⌚ 10:30-11:00	Kaffeepause/Besuch der Ausstellung		
	Industrielle Datenerfassung und Signalkonditionierung	Anwendungsentwicklung, Tipps & Tricks	Automatisierte Prüfsysteme
11:00-11:30	Moderne Datenerfassungsarchitekturen Andreas Scholz, National Instruments Germany GmbH	Leistungs- & Geschwindigkeitssteigerung von LabVIEW-Projekten Christian Mergl, National Instruments Germany GmbH	Von Beginn an erfolgreich: Der mühelose Umstieg auf NI LabVIEW Real-Time und FPGA Sascha Egger, National Instruments Switzerland Corp.
11:30-12:00	Einzelmodulprüfstand für zehn Photovoltaikmodule zur Vermessung des Betriebswirkungsgrades und des Betriebsverhaltens Prof. Dr. Peter Zeller, FH Oberösterreich/ Fakultät Wels	Netzwerkkommunikationstechniken in NI LabVIEW Daniel Riedelbauch, National Instruments Germany GmbH	Entwicklung neuer sensorloser Regelungsstrategien für elektrische Antriebe unter Anwendung eines kombinierten Mess- und Regelungssystems Peter Nussbaumer, Dr. Markus A. Vogelsberger, TU Wien
12:00-12:30	Wireless-Sensornetzwerke Sascha Egger, National Instruments Switzerland Corp.	Wissenswertes für das Erstellen von Benutzeroberflächen in NI LabVIEW Christoph Landmann, National Instruments Germany GmbH	Messung der Auswirkungen von ionisierender Strahlung auf CMOS-Schaltungen Michael Hofbauer, Kurt Schweiger, TU Wien
⌚ 12:30-13:30	Mittagspause/Besuch der Ausstellung		
	Industrielle Datenerfassung und Bildverarbeitung	Versuchssteuerung und technisches Datenmanagement	Automatisierte Prüfsysteme
13:30-14:00	The Future of Condition Monitoring: Prognostics Systems Using COTS Technologies Lodovico Menozzi, National Instruments Italy	Die Plattform NI CompactRIO und ihre Neuerungen Paul Schmitzberger, National Instruments Austria	Hardware-compatible Waveform Compression for Use on LabVIEW FPGA Benjamin Steinwender, MSc Kompetenzzentrum Automobil- und Industrie-Elektronik GmbH
14:00-14:30	Realisierung eines OCR-Systems im Stahlwerk Oliver Sidla, SLR Engineering	CompactRIO-basierte Regler für servohydraulische Prüfzylinder Klaus Sobe, Dr. Thomas Thurner, TU Graz	Neuerungen für automatisierte Testsysteme mit PXI Helmut Wurm, National Instruments Austria
14:30-15:00	Grundlagen der Leistungsmessung Marco Brauner, National Instruments Germany GmbH	DIAdem und LabVIEW Real-Time als Basis für ein universelles Prüfstandskonzept in der Dauererprobung Holger Müller, a-solution	Vorteile softwaredefinierter RF-Testsysteme Christian Gindorf, National Instruments Germany GmbH
⌚ 15:00-15:30	Kaffeepause/Besuch der Ausstellung		
	LabVIEW-Zertifizierung	Industrial Measurement & Control	Automatisierte Prüfsysteme
15:30-16:00		Grundlagen der Motorsteuerung mit NI LabVIEW Christian Mergl, National Instruments Germany GmbH	Die Herausforderungen analoger Messtechnik mit bis zu 12,5 GS/s bewältigen Marco Brauner, National Instruments Germany GmbH
	CLAD-Zertifizierung		
16:00-16:30		Steuerung einer Galvanisierungsanlage mit LabVIEW Johannes Prodingler, Hunyadi Technisches Büro für technische Chemie	Burn-in Test zur Voralterung von elektronischen Baugruppen Marco Weidmann, ad+t AG
⌚ 16:30-17:30	Stehempfang/Besuch der Ausstellung		

## Ausstellung: Networking im exklusiven Rahmen

→ In der kongressbegleitenden Ausstellung präsentieren Produktpartner und Systemintegratoren aktuelle Anwendungen, Lösungen und Produkte. Nutzen Sie diese Chance, um sich über neueste Entwicklungen zu informieren, interessante Kontakte zu knüpfen und potenzielle Geschäftspartner kennenzulernen.

### 🕒 **Ausstellungszeit** 08:15-17:30

#### **ad+t AG**

Ihr Partner für Testsystemlösungen – unser Spektrum reicht von In-Circuit-Test, Flying Probe Test, JTAG/Boundary Scan Test, AOI/AXI-optische Inspektion, Funktionstestsystem bis hin zu Multimode-Testsystemen. [adt.ch](http://adt.ch)

#### **a-solution**

a-solution liefert technisch kompetente DIAdem- und LabVIEW-Komplettlösungen im Bereich Mess- und Prüfstandstechnik, Datenhaltung und -auswertung.

[a-solution.de](http://a-solution.de)

#### **BEKO Engineering & Informatik AG**

Die BEKO Engineering & Informatik AG ist Österreichs größter Anbieter von Solutions und Services für Industrieunternehmen, die öffentliche Verwaltung und den Finanzsektor. Grundlage ist ein integriertes Geschäftsmodell aus Engineering und Informatik, das system- und branchenübergreifende Gesamtlösungen von hoher Performance und Wirtschaftlichkeit für den Kunden entwickelt. [beko.at](http://beko.at)

#### **Konrad GmbH**

Das Unternehmen entwickelt, fertigt und integriert kundenspezifische Testsysteme für die Elektronikfertigung. Technologien: FKT, ICT, AOI, HF, Halbleiter und Softwarelösungen. [konrad-technologies.de](http://konrad-technologies.de)

#### **National Instruments**

Pionier der Technologien rund um die Mess- und Automatisierungstechnik und um das Konzept der virtuellen Instrumente – für höhere Leistung bei gesenkten Kosten. [ni.com](http://ni.com)

Stand Dezember 2011

## Specials: Damit sich Ihr Besuch in jeder Hinsicht lohnt

→ Nutzen Sie Ihren Besuch des NIDays, um sich Ihre Zertifizierung schnell und einfach zu sichern!

### CLAD-Zertifizierung

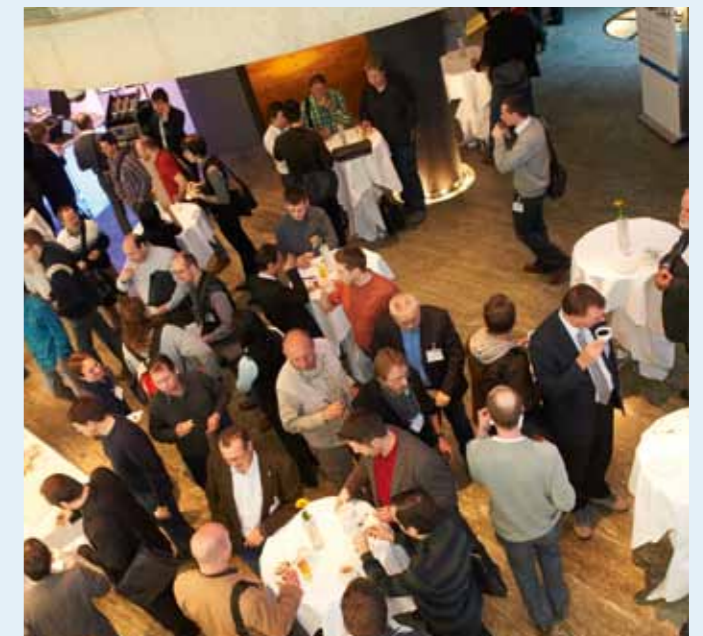
Im Rahmen des Kongressbesuchs haben Sie die Möglichkeit, kostenfrei an der CLAD-Zertifizierung (Certified LabVIEW Associate Developer) teilzunehmen. Zertifizierungen unterstreichen Ihre technischen Kenntnisse und Fähigkeiten. Somit sind Sie für große Herausforderungen bestens gerüstet und verfügen durch das industrieweit anerkannte Zertifikat über eine optimale Referenz und einen Qualitätsnachweis.



## NIDays 2012: Ein ganzer Tag im Zeichen der Innovationen

### Das erwartet Sie am 28. März 2012:

- über 150 erwartete Besucher
- 2 Keynotepräsentationen
- 22 Technologie- und Anwendervorträge
- Kongressbegleitende Ausstellung
- Kostenfreie CLAD-Zertifizierung
- Networking – Neue Kontakte – Austausch



### Medienpartner:



# Anmeldung zur Teilnahme am Kongress

Bitte ankreuzen und mit Anschrift des Teilnehmers vollständig ausgefüllt **per Fax**  
an National Instruments schicken: **+49 89 7146035**

Bitte wählen Sie Ihren Tarif:

- Frühbucherpauschale**      **EUR 70,-**    zzgl. MwSt.    bei Anmeldung bis 24. Februar 2012
- Tagungspauschale**      **EUR 95,-**    zzgl. MwSt.    bei Anmeldung ab 25. Februar 2012
- Gruppenticket** Melden Sie 2 Personen zu den NIDays an, erhalten Sie eine 3. Kongressteilnahme kostenlos.  
**EUR 140,-**    zzgl. MwSt.    bei Anmeldung bis 24. Februar 2012  
**EUR 190,-**    zzgl. MwSt.    bei Anmeldung ab 25. Februar 2012

Bitte geben Sie Name, Vorname und E-Mail-Adresse aller angemeldeten Personen an:

Name, Vorname, E-Mail: \_\_\_\_\_

Name, Vorname, E-Mail: \_\_\_\_\_

Name, Vorname, E-Mail: \_\_\_\_\_

- Studentenpauschale**      **EUR 50,-**    zzgl. MwSt.  
Für Studenten (Kopie der Studienbescheinigung mitschicken). Ausgenommen sind Personen, die nebenberuflich einer Weiterbildung nachgehen.
- CLAD-Zertifizierung**      **Kostenlos** (nur in Verbindung mit einer Kongressteilnahme möglich)

Herr    Frau

Name, Vorname: \_\_\_\_\_ Firma/Abteilung: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_ PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Rechnungsadresse (falls abweichend) \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum, Ort: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
rechtsverbindliche Unterschrift/Firmenstempel

**Leistungen:** Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme am eintägigen Kongress NIDays 2012, eine Kongresstasche und Verpflegung.

**Rücktritt:** Ihre Anmeldung gilt als verbindlich. Bis 24. Februar 2012 ist der kostenlose Rücktritt von der Teilnahme an den NIDays 2012 möglich.

**Dieser muss NI schriftlich mitgeteilt werden.** Nach diesem Datum gelten folgende Rücktrittsbedingungen:

**Stornierung bis 9. März 2012: 50 % der Teilnahmegebühr, ab 10. März 2012: 100 % der Teilnahmegebühr**

## Veranstaltungsort

Studio 44 der Österreichischen  
Lotterien  
Rennweg 44, 1038 Wien  
www.studio44.at

## Veranstalter

National Instruments Ges.m.b.H. (Austria)  
Plainbachstr. 12, 5101 Salzburg-Bergheim  
Tel.: +43 662 457990-0  
Fax: +43 662 457990-19



Sämtliche Informationen zum Kongress finden Sie auch unter [ni.com/austria/nidays](http://ni.com/austria/nidays).